

Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Instytut Technologii Mechanicznej

Politechnika Poznańska
60-965 Poznań, pl. Skłodowskiej-Curie 5
tel.: 0-61-665-3569
fax.: 0-61-665-3595

Serdecznie zapraszamy na siódme Konwersatorium

**Stereometria powierzchni:
Pomiary, badania, aplikacje,**
które odbędzie się
10 - 11 KWIETNIA 2008 roku,

w Ośrodku Kwalifikacji Jakości Wyrobów „SIMPTEST”,
ul. Przemysłowa 34A w Poznaniu.

Ramowy program spotkania:

10.04.2008 r. czwartek

10.00 - 11.00	zakwaterowanie
11.00 - 13.45	Sesja I
12.30 - 12.45	Przerwa na kawę
13.45 - 14.45	obiad
15.30 - 18.00	Sesja II
16.45 - 17.00	przerwa na kawę
19.00 -	Uroczysta kolacja

11.04.2008 r. piątek

9.00 - 13.00	Sesja III
10.30 - 11.00	Przerwa na kawę
13.00 - 14.00	obiad

Komitet organizacyjny:

prof. dr inż. Jan Chajda
dr inż. Andrzej Cellary
dr inż. Michał Wieczorowski
mgr inż. Radomir Majchrowski

e-mail:

jan.chajda@put.poznan.pl
andrzej.cellary@put.poznan.pl
michal.wieczorowski@put.poznan.pl
radomir.majchrowski@interia.pl
<http://zmisp.mt.put.poznan.pl>

Program spotkania:

10.04.2008 r. czwartek

10.00 - 11.00 zakwaterowanie

11.00 - 13.45 Sesja I

Prowadzenie obrad - *prof. dr inż. Jan Chajda*

J. Chajda: Wprowadzenie.

P. Andrałojć: Wstęp do nanometrologii.

12.30 - 12.45 Przerwa na kawę

M. Józefowicz, R. Majchrowski: Zastosowanie AFM Caliber i profilometru optycznego Wyko NT1100 w metrologii warstwy wierzchniej.

13.45 - 14.45 obiad

15.30 - 18.00 Sesja II

Prowadzenie obrad - *prof. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz*

Prezentacja centrum nanometrologii w ZMiSP – AFM Kaliber i profilometr optyczny Wyko NT1100.

16.45 - 17.00 Przerwa na kawę

M. Wieczorowski, A. Cellary, R. Majchrowski: Omówienie realizacji projektu badawczego: „Analiza wiarygodności i odtwarzalności pomiarów chropowatości powierzchni”.

19.00 -

Uroczysta kolacja

11.04.2008 r. piątek

9.00 - 13.00 Sesja III

Prowadzenie obrad - *prof. dr hab. inż. Paweł Pawłus*

P. Dobrzański: Opracowanie i zastosowanie algorytmów filtracji cyfrowej w pomiarach struktury geometrycznej powierzchni.

V. Lubimow: Istotność parametrów struktur geometrycznych powierzchni.

10.30 - 11.00 Przerwa na kawę

J. Gruszka, R. Maciejewski: Praktyczne problemy w pomiarach struktury geometrycznej powierzchni honowanych – oczekiwania względem nauki.

13.00 - 14.00 obiad